

0.1 μm尘埃粒子计数器系列

NW-101X Pro / NW-110X Pro | 2.83 / 28.3 L/min

面向检测标准或监测方案明确要求从0.1 μm开始监测的半导体洁净室、精密电子制造及超高洁净等级环境。

半导体洁净室

精密电子制造

超高洁净环境

工艺环境监测



0.1 μm
起测粒径

2款
固定流量型号

2.83 / 28.3
L/min

8
粒径通道

0.1 μm监测的三项使用价值

01

满足0.1 μm监测要求

从0.1 μm开始记录颗粒数据，适用于检测标准或监测方案明确要求0.1 μm通道的半导体洁净环境。

02

按场景选择流量

2.83 L/min与28.3 L/min对应不同采样节拍；结合目标体积、点位数量和监测方案确定型号。

03

点位与记录管理

可管理区域、房间、点位与采样任务，并支持记录查询和数据输出，建立完整的现场监测记录。

型号、流量与粒径通道

型号	采样流量	起测粒径	粒径通道
NW-101X Pro	2.83 L/min	0.1 μm	0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0 μm
NW-110X Pro	28.3 L/min	0.1 μm	0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0 μm

任务与记录管理

可管理区域、房间、点位与采样任务，并支持记录查询和数据输出，服务半导体洁净环境的现场监测流程。

以上页面所列功能均为当前标准配置；蓝牙针式打印机和扫码枪为选配，其他特殊需求可按项目评估定制。

预约苏州实机演示 | 王陈燕 | sale@nuoweiclean.cn | nuoweiclean.cn